



CURSOS DEL CITIUS

EL SECRETARIADO DE CENTROS, INSTITUTOS, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN (SCISI) Y DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (CITIUS)
EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE (CFP)

COMUNICA

Que se va a impartir el curso que se relaciona a continuación:

2011-05-10_MIC-B-JEOL: III CURSO DE FORMACIÓN EN “MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (JEOL-6460LV)”.

Contenidos:

1. Normas y riesgos asociados al uso del microscopio electrónico de barrido.
2. Fundamentos de la microscopía electrónica de barrido.
3. Visualización y obtención de imágenes en:
 - Alto vacío. Detectores de electrones secundarios y electrones retrodispersados.
 - Bajo vacío. Detector de electrones retrodispersados.
4. Análisis elemental mediante rayos X.
5. Preparación de muestras.
6. Configuración de parámetros según el tipo de muestras.

Destinatarios: Cualquier persona cuya actividad o investigación esté o vaya a estar relacionada con la microscopía electrónica de barrido.

Duración, fechas y horario: 25 horas (5 teóricas y 20 prácticas); del 10 al 31 de mayo de 2011.

Más información y plazos de preinscripción y matrícula: Consultar página web del CFP.

http://www.cfp.us.es/web/ficha_avanzada.asp?id_titulo=954&tipo=FC&basica=1

Coste de matrícula: 195.00 € (tasas no incluidas).

